# **APÉNDICE A:**

## **COORDENADAS DE COLOR.**

La medida del color entraña una gran problemática ya que es la interpretación sensorial de una radiación de composición espectral determinada. Bajo el punto de vista sensorial se definen tres características del color percibido: la *luminosidad*, atribuida a la sensación visual según la cual una superficie parece emitir mayor o menor flujo luminoso; el *tono*, que da cuenta de la sensación visual asociada a la composición espectral de la radiación percibida y que ha suscitado nombres como azul, verde, amarillo o rojo; y la *saturación*, atributo de la sensación visual que permite estimar la proporción de color cromático puro contenido en la sensación total. El tono y la saturación definen las características de un estímulo de color y reciben, en conjunto, el nombre de *cromaticidad* [Gilabert].

Dado que el color es una sensación psicofísica, la especificación de esta magnitud en un marco objetivo es una tarea complicada. Desde hace unos doscientos años se sabe que un observador normal es capaz de reproducir el efecto de cualquier estímulo de color combinando la luz de tres fuentes primarias en las proporciones de luminancia adecuadas, que han de verificar que la mezcla de cantidades numéricas de luminancia iguales de cada una de ellas logre una luz blanca especial (blanco de equi-energía) [Gilabert]. Con este método, un color desconocido puede especificarse mediante un conjunto numérico denominado *valores triestímulos*. Por consenso y, en un principio, las fuentes primarias se eligieron monocromáticas: roja (700 nm), verde (546.1 nm) y azul (435.8 nm); este sistema es el conocido como RGB. A partir de aquí cualquier color (C) se podría especificar inequívocamente por la terna de luminancias (R,G,B) de modo que

$$C = R(rojo) + G(verde) + B(azul)$$
(A.1)

Sin embargo, se acabaría demostrando que la totalidad de los colores reales no podía ser representada por un conjunto de valores (RGB) reales y positivos. Por este motivo se eligieron tres nuevas fuentes primarias. Éstas, definidas por las llamadas *funciones colorimétricas* ( $\xi(\lambda), \psi(\lambda), \zeta(\lambda)$ ), están representadas en la Fig. A.1 y componen el Sistema Colorimétrico Patrón CIE 1931. Las coordenadas que especifican un color cualquiera en este sistema colorimétrico se definen *valores triestímulos espectrales* (X,Y,Z).



**Fig. A.1.** Representación de las funciones colorimétricas en función de la longitud de onda.

Para calcular las coordenadas cromáticas de una radiación compuesta, se ha de conocer la distribución espectral de ésta. Por ejemplo, en medidas de espectrofotometría, serían los espectros de reflexión de las muestras,  $R(\lambda)$ . En este caso, los valores triestímulos vienen dados por:

$$X = \int_{\lambda_{1}}^{\lambda_{2}} R(\lambda)\xi(\lambda)d\lambda$$
  

$$Y = \int_{\lambda_{1}}^{\lambda_{2}} R(\lambda)\psi(\lambda)d\lambda$$
 (A.2)  

$$Z = \int_{\lambda_{1}}^{\lambda_{2}} R(\lambda)\zeta(\lambda)d\lambda$$

donde  $\lambda_1 = 380$  nm y  $\lambda_2 = 780$  nm. Hay que destacar que la luminosidad de la muestra es igual a Y×683. A partir de aquí, la evaluación de la cromaticidad de un estimulo de color se lleva a cabo definiendo tres variables nuevas, llamadas *coordenadas de cromaticidad*,

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$
  

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$
  

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$
(A.3)

Sólo dos de éstas variables son independientes, pues x + y + z = 1.

La descripción completa de un color en el sistema CIE comprende la tríada (x,y,Y). Las coordenadas (x,y) son seleccionadas para evaluar la cromaticidad de la muestra e Y para la luminosidad. Además, la pareja (x,y) se puede representar en el *diagrama de cromaticidad CIE 1931*, el cual muestra de forma visual la cromaticidad de la muestra (Fig. A.2).



**Fig. A.2.** Representación del diagrama de cromaticidad según el patrón CIE 1931.

En realidad existen muchos espacios de color definidos por coordenadas colorimétricas relacionadas con (X,Y,Z) mediante expresiones matemáticas más o menos complicadas. Estos espacios de color persiguen, con mayor o menor fortuna, una representación espacial de la sensación del color. Algunos de estos espacios colorimétricos son, además del CIE 1931, el CIE-UCS 1960, el CIE 1964, el CIELUV 1976 y el CIELAB.

# **APÉNDICE B:**

# DEDUCCIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LA FLUENCIA Acumulada.

Para poder describir en términos físicos los efectos producidos en un material al ser procesado con láser, se puede utilizar, además de las variables habituales referentes al haz, la *fluencia acumulada (F<sub>a</sub>)*. Este parámetro se define como la energía láser acumulada por unidad de área durante el tratamiento del material. Así, si se irradia con N pulsos láser en una posición determinada, la energía total depositada en el substrato será N·E<sub>p</sub>, siendo E<sub>p</sub> la energía de un sólo pulso. Evidentemente, la expresión de la fluencia acumulada será

$$F_a = N \frac{E_p}{S} = NF \tag{B.1}$$

donde S es el área irradiada y F es la fluencia correspondiente a cada pulso láser.

En el caso de realizar una traza láser de longitud L, con una velocidad de barrido del haz sobre la muestra v (Fig. B.1) y considerando que la potencia media emitida por el sistema láser ( $P_m$ ) sea constante y el diámetro del haz sobre la superficie de la muestra sea D, se puede definir de forma análoga la fluencia acumulada al efectuar dicha traza como

$$F_a = \frac{E_{traza}}{S_{traza}} \tag{B.2}$$

donde  $E_{traza}$  y  $S_{traza}$  son la energía total depositada por el haz láser al marcar la traza y el área en el que se deposita la energía. De forma trivial se puede deducir que, si t es el tiempo invertido en marcar dicha traza, entonces,

$$E_{traza} = P_m t \tag{B.3}$$

$$L = vt \tag{B.4}$$

$$S_{traza} = LD$$
 (si L >> D) (B.5)

Sustituyendo las ecuaciones B.3, B.4 y B.5 en B.2 se obtiene,

$$F_a = \frac{P_m t}{v t D} = \frac{P_m}{v D} \tag{B.6}$$

que es la expresión que utilizamos en el estudio de las muestras. Se ha de indicar que este parámetro se refiere a la energía emitida por el sistema láser al realizar los tratamientos y no tiene en cuenta la fracción de ésta que es absorbida en la superficie del material, lo que le confiere un carácter independiente del tipo de material irradiado y de los fenómenos físicos que pueden afectar sobre la absorción de la radiación.



**Fig. B.1.** Realización de una traza láser de longitud L. El haz láser, de diámetro D, se desplaza a velocidad constante v.

# **APÉNDICE C:**

# ESTUDIO AES DE UN PATRÓN VOLÚMICO DE $\beta$ -Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.

En la Sección IV.2.2.c se presenta el mapa AES de concentración relativa de oxígeno sobre titanio de un área de la muestra tratada con láser en modo pulsado con 294 J/cm<sup>2</sup> y con 200  $\mu$ m de distancia entre trazas consecutivas. Dado que esta técnica es muy superficial y sólo puede analizar la composición hasta profundidades de pocos nanómetros, el carbono superficial depositado en la superficie de la muestra falsea considerablemente las medidas. Por este motivo, se somete la muestra a un ataque con iones Ar<sup>+</sup> durante 6 s para eliminar este carbono. Sin embargo, al finalizar el proceso se observa un cambio en la composición superficial de la muestra. Para estudiar este efecto se realiza un análisis de la concentración de oxígeno sobre la de titanio (estequiometría) de un patrón volúmico de  $\beta$ -Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (polvo sinterizado) al ser atacado por un haz iónico en las mismas condiciones que las utilizadas con la muestra mencionada anteriormente.

La Fig. C.1 muestra la evolución de la estequiometría de la superficie del patrón de  $\beta$ -Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en función del tiempo de ataque. Como se puede apreciar, ésta disminuye considerablemente en los primeros segundos de ataque, estabilizándose entorno a 0.5 a partir de aproximadamente 2 min. Puesto que el valor real en toda la muestra ha de ser 1.5, se puede afirmar que este efecto es la consecuencia de la amorfización del material y de la eliminación preferencial del oxígeno superficial por la acción del ataque iónico. Por otro lado, a partir de estos resultados se puede hallar un factor de corrección para compensar este efecto y poder conocer la estequiometría real del material analizado. Definimos el *factor de corrección de reducción* para un tiempo de ataque iónico t, f(t), como la relación de la estequiometría real y la medida al cabo de un tiempo t de ataque iónico. Es decir,

$$f(t) = \frac{\left[\frac{O}{Ti}\right]_{real(t)}^{patrón}}{\left[\frac{O}{Ti}\right]_{medida(t)}^{patrón}}$$
(C.1)

Dado que en el patrón, de composición constante, se tiene  $[O / Ti]_{real} = 1.5$  en todos los casos, el valor de f(t) representa el cambio de composición debido al ataque iónico y, además, basta con multiplicar el valor de la estequiometría medida en un tiempo t<sub>0</sub> por el factor f(t<sub>0</sub>) para obtener la concentración real del patrón que, obviamente, resulta ser 1.5.



**Fig. C.1.** Evolución de la concentración de oxígeno medido mediante AES en el patrón de  $\beta$ -Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub> al ser atacado con un haz de iones Ar<sup>+</sup> en las mismas condiciones que los mapas AES realizados a muestras tratadas con láser pulsado.

En una primera aproximación se puede asumir que la muestra obtenida con láser, la cual se somete a un ataque de 6 s para realizar el mapa AES, evoluciona de forma semejante al patrón con lo que su estequiometría real se podría calcular mediante la expresión,

$$\left[\frac{O}{Ti}\right]_{real(6)}^{muestra} = f(6) \cdot \left[\frac{O}{Ti}\right]_{medida(6)}^{muestra}$$
(C.2)

donde, según las medidas realizadas en el patrón, f(6) = 1.544. Este factor se multiplica por cada uno de los valores de la estequiometría obtenidos en el mapa AES después del ataque iónico, ofreciendo el mapa de composición que debería obtenerse sin dicho ataque y sin la influencia del carbono superficial.

# **APÉNDICE D:**

# **PROGRAMAS INFORMÁTICOS.**

A continuación se realiza una breve descripción de algunos de los programas informáticos elaborados en el transcurso de esta tesis y que nos han permitido efectuar simulaciones de modelos físicos sencillos, calcular las coordenadas de cromaticidad de las muestras, así como llevar a cabo la automatización de ciertos procesos en el marcado de imágenes en color sobre titanio. Todos los programas se han realizado con lenguaje Borland Delphi versión 5, que permite que sean ejecutados sin problemas en entornos MS-Windows.

### D.1 Programa 'InterfExtrem'.

Este programa simula el espectro de reflexión producido por fenómenos de interferencias en una capa transparente de espesor d y con índice de refracción  $n_1$ , sobre un substrato con índice de refracción  $n_2$  y coeficiente de extinción  $\kappa_2$ , ambos inmersos en un medio de índice  $n_0$  (Fig. D.1).

El cálculo de la reflectancia se realiza mediante la fórmula I.8 (*Sección I.3.2.d*) y el procedimiento es el siguiente: a partir del espectro de reflexión de una muestra determinada, se extraen las longitudes de onda en las que se observan un máximo ( $\lambda_{max}$ ) y un mínimo ( $\lambda_{min}$ ) consecutivos de la reflectancia (Fig. D.2). A continuación, se introducen estos valores en sus correspondientes apartados en el grupo 'Parámetros' y se elige un intervalo de longitudes de onda lo más ajustado posible que contenga a  $\lambda_{max}$  y a  $\lambda_{min}$  en el



Fig. D.1. Programa InterfExtrem.

grupo 'Rangos'. Hay tres modalidades de simulación en las que se puede mantener como parámetros fijos (n<sub>0</sub>, n<sub>2</sub>,  $\kappa_2$ ) eligiendo como variables (n<sub>1</sub>, d), o mantener fijos (n<sub>0</sub>, n<sub>1</sub>,  $\kappa_2$ ) y variar (n<sub>2</sub>, d) o, incluso, variar (n<sub>1</sub>, d) manteniendo fijo n<sub>0</sub> pero teniendo en cuenta la dependencia con la longitud de onda de n<sub>2</sub> y  $\kappa_2$ , los cuales se extraen desde un fichero de texto (ntitanio.dat). En todos estos casos se han de elegir los rangos en los que el programa ha de variar n<sub>1</sub> (n<sub>2</sub>) y d, donde n<sub>1</sub> (n<sub>2</sub>) varía en intervalos de 0.1 y d en intervalos configurables de  $\Delta d$ . Al pulsar el botón 'Ejecutar', el programa simula todos los espectros de reflexión compatibles con los rangos de variables elegidos. Sin embargo, de todos estos espectros sólo selecciona aquellos que presenten un máximo y un mínimo consecutivos de la reflectancia situados, respectivamente, en las longitudes de onda  $\lambda'_{max}$  y  $\lambda'_{min}$  que verifiquen la condición,

$$e = \sqrt{\left(\lambda'_{\max} - \lambda_{\max}\right)^2 + \left(\lambda'_{\min} - \lambda_{\min}\right)^2} \le 10$$
 (D.1)

es decir, que el error cuadrático total de sus posiciones relativas sea menor que 10. Finalmente, los conjuntos de valores que producen espectros de reflexión compatibles con esta condición son representados en el grupo 'Resultados'. Pulsando en los botones '+' y '-' se puede efectuar la exploración de todos estos resultados. Cada uno de estos espectros es grabado en el archivo de texto 'reflectancia.dat' para, posteriormente, poder ser representado por cualquiera de los programas de tratamiento de datos más comunes.



**Fig. D.2.** Espectro de reflexión medido por espectrofotometría y su equivalente simulado con el programa InterfExtrem de la muestra anodizada con 16 V.

# D.2 Programa 'InterfCrom'.

Este programa calcula las coordenadas cromáticas en los espacios CIE1931 y CIELAB que presentaría, debido a fenómenos interferenciales, una capa transparente de espesor d y con índice de refracción  $n_1$ , sobre un substrato con índice de refracción  $n_2$  y coeficiente de extinción  $\kappa_2$ , ambos inmersos en un medio de índice  $n_0$ . Una vez introducidos todos estos datos en el programa (Fig. D.3), el procedimiento consiste, en primer lugar, en la simulación del espectro de reflexión que presentaría este sistema calculado a partir de la ecuación I.8 (*Sección I.3.2.d*) y, posteriormente, en el cálculo de los valores triestímulos espectrales (X, Y, Z) según el conjunto de ecuaciones A.2. Las funciones colorimétricas, necesarias para éste cálculo, están contenidas en el fichero 'cie1931.txt'. De forma opcional se pueden visualizar las coordenadas de espacio CIELAB obtenidas con la ayuda de las siguientes expresiones,

$$L^{*} = \begin{cases} 116 \cdot \sqrt[3]{\frac{Y}{Y_{n}}} - 16 \Leftrightarrow \left(\frac{Y}{Y_{n}}\right) > 0.008856 \\ 903.3 \cdot \left(\frac{Y}{Y_{n}}\right) \Leftrightarrow \left(\frac{Y}{Y_{n}}\right) \le 0.008856 \end{cases}$$
(D.2)

$$a^{*} = \begin{cases} 500 \cdot \left[ \sqrt[3]{\frac{X}{X_{n}}} - \sqrt[3]{\frac{Y}{Y_{n}}} \right] \Leftrightarrow \left( \frac{Y}{Y_{n}} \right) > 0.008856 \\ \\ 500 \cdot 7.787 \cdot \left[ \left( \frac{X}{X_{n}} \right) - \left( \frac{Y}{Y_{n}} \right) \right] \Leftrightarrow \left( \frac{Y}{Y_{n}} \right) \le 0.008856 \end{cases}$$
(D.3)

$$b^{*} = \begin{cases} 200 \cdot \left[ \sqrt[3]{\frac{Y}{Y_{n}}} - \sqrt[3]{\frac{Z}{Z_{n}}} \right] \Leftrightarrow \left( \frac{Y}{Y_{n}} \right) > 0.008856 \\ \\ 200 \cdot \left[ \left( \frac{Y}{Y_{n}} \right) - \left( \frac{Z}{Z_{n}} \right) \right] \Leftrightarrow \left( \frac{Y}{Y_{n}} \right) \le 0.008856 \end{cases}$$
(D.4)

donde la calibración del espectrofotómetro Shimadzu UV-2101PC ha permitido deducir los valores  $X_n = Y_n = 1088$  y  $Z_n = 1094$ .



Fig. D.3. Programa InterfCrom.

## D.3 Programa 'Cromat'.

Este programa calcula las coordenadas colorimétricas de cualquier muestra a partir de su espectro de reflexión obtenido con el espectrofotómetro Shimadzu UV-2101PC utilizando una referencia de BaSO<sub>4</sub>. Para obtener dichas coordenadas, basta con cargar el archivo ASCII correspondiente al espectro de reflexión de la muestra deseada (Fig. D.4). El cálculo de los valores triestímulos (X, Y, Z), las coordenadas de cromaticidad (x, y, z) y los valores LAB (L<sup>\*</sup>, a<sup>\*</sup>, b<sup>\*</sup>) se efectúa con los mismos procedimientos utilizados en el programa 'InterfCrom'.



Fig. D.4. Programa Cromat.

### D.4 Programa 'TifFpt'.

Este programa permite transformar imágenes TIFF a programas forma (FPT) realizados en el lenguaje de programación utilizado por el software del sistema láser (Baasel LBI-6000), para efectuar el marcado píxel a píxel de imágenes digitales en color sobre titanio. El procedimiento a seguir es el siguiente:

En primer lugar se carga en memoria RAM la imagen TIFF deseada (botón 'Abrir'), la cual ha de ser en blanco y negro, sin comprimir (1 bit por píxel) y con un máximo de 512000 píxeles. En el grupo 'Imagen' se muestra una serie de datos referentes a la imagen (dimensiones, número de píxeles, etc) e, incluso, ésta se puede invertir. En la zona inferior derecha se representa dicha imagen (Fig. D.5). A continuación, en el grupo 'Parámetros' se introducen los valores de los parámetros tecnológicos requeridos para obtener el color deseado y que han de ser anteriormente seleccionados a partir de las paletas de colores realizadas con píxeles. Los parámetros a modificar son la frecuencia de disparo, la intensidad de la lámpara de excitación, los tiempos de apertura y de espera, la distancia

entre píxeles consecutivos en el plano focal imagen de la lente y, finalmente, la posición inicial en dicho plano para el marcado de la imagen. Al pulsar el botón 'Grabar' comienza el proceso de creación de los programas forma que, al ser ejecutados en el sistema láser, serán los encargados de marcar la imagen sobre el substrato. Debido a la limitada memoria RAM que posee el sistema informático del equipo, no es posible realizar un sólo programa forma para cada imagen, sino que se ha de crear una serie de programas numerados, en la que cada uno de ellos contiene las instrucciones para marcar un máximo de 750 píxeles. Puesto que, en algunos casos, el número de estos programas a ejecutar puede ser considerable, también se crea un programa cargador 'nombre-elegido00.fpt' que se encarga de ejecutar consecutivamente todos los demás, por lo que sólo habrá que ejecutar este programa cargador ('cargador.fpt') de todos los programas forma que se encuentren en la unidad de disco mediante la opción 'Cargador de A:\'. Con esta modalidad se consigue realizar el proceso de marcado ejecutando los programas desde la unidad de disco del sistema láser y, de esta manera, se evita tener que grabarlos en el disco duro.



Fig. D.5. Programa TifFpt.

# **APÉNDICE E:**

# **RELACIÓN DE MUESTRAS EFECTUADAS.**

A continuación se presenta una lista con todas las muestras realizadas en el presente trabajo en la que se indican los valores de los parámetros tecnológicos involucrados en los procesos así como algunos comentarios explicativos.

E.1 Muestras con p	íxeles de colores.
--------------------	--------------------

Muestra	Frecuencia [kHz]	Intensidad [A]	Tiempos de apertura / espera [ms]	Distancia entre píxeles [µm]	Distancia lente- substrato [mm]	Comentarios
EA45	1	12,14,16, 17,18,19	-	-	90 - 99	Un único pulso láser. Capítulo III.
PIXEL1	5,10,15,20, 25,30	19	0.1 - 1000 / 0	500	179	
PIXEL2 PIXEL3 PIXEL4	-		2-32/0	400		
PIXEL5	15,20,25,30		8,10 / 0.1 – 1000	400		Matrices de píxeles con lente de f = 160 mm.
PIXEL6 PIXEL7	-		2-32/10	300,400 200		
PIXEL8			4,10 / 0.1,10,20	300		

PIXEL9			4,8,10,12,14,	300		
PIXEL10			16,18,20 / 0	400		Orden alternado.
PIXEL11			4,5,8,14 / 10			Mezcla alternada de
PIXEL12			4,5,8,14 /			níxeles de colores
TIXEE12			100	300		pixeles de colores.
PIXEL13			4 / 1,10,100,			
			1000			
PIXEL14			4,8,10,12,14,	200		
			16,18,20 / 0			
PIXEL15			4 / 1,10,100,	200,500		Orden alternado.
			1000			
PIXEL16	30		4/0	300		
PIXEL17			4 - 2,3,3.5 /	300		
DIVEL 17A			10,20,100	200		
PIAELI/A			4 / 20	300		
PIXEL18			20 100	300,400		
			5.11/			Color uniforme.
PIXEL18A			20 100	400		
PIXEL19			1 / 0,20			
PIXEL20			2 / 0,20	300		Múltiples pasadas.
PIXEL21			4,6 / 0,20			
				200		Solapamiento
PIXEL22			0.1 - 16 / 0	300		bidimensional.
PALETA	30	19	2-25.5/20	300	179	Paleta de píxeles.
PV1			2 - 16 / 0.20	300	94	Píxeles de colores con
IAI			2 - 10 / 0,20	500	74	lente de $f = 100$ mm.
PX2	15,20,25,30	19	2-32/1			
PX3		-	2-32/	100	94	
			10,50			
PX4	2.2		2 - 16 / 10	100		
PX5	30	17,19	0.1 – 17 /	100	98,99	
-			10,20,50			
PX6	20.25.20	16.17	2 - 32 /	100	99	
DV7	20,23,30	10,17	10,20,30			
Γ <b>Λ</b> /			2-32/20			

DVO	5,10,20,	17 10	2-32/			
PA8	25,30	17,18	10,20			
DVO		15 10	2-32/			
РЛУ		15,19	0.1,10,50			
DV10			2 110/10	70,100,	02.00	
1 110			2 - 110 / 10	125	92,99	
PX11		19	2-32/10	125		
DV12	20,25,30		2-32/			
FA12			50,100	70		
PX13		16,19	2-32/50		94	
PX14				125		
PX15		19	2-32/10	200		
PX16				100		
PX17	0	15 19	2 – 16 /	100 200	94,96	Modo continuo
PX18	Ū	15,19	10,50	100,200	92,94	Modo continuo.
DS	20.30	15.5,18.5,	0.0 185/	1000	170	Medida de diámetros de
05	20,30	19	0.7 - 10.57 -	1000	1/2	píxeles.
LIN	30	19	0.9 - 18.5 / -	1000	179	Lente de $f = 160 \text{ mm}.$
	50	17	0.9 - 10.57 -	1000	177	Capítulo III.

# E.2 Muestras con trazas láser.

Muostra	Frecuencia	Intensidad	Velocidad de barrido	Distancia lente-	Comontarios	
muestru	[kHz]	[A]	[mm/s]	substrato [mm]	Comentarios	
LS1	1	19	40,75,120,225			
LS2	10,30		400,750,1200			
LS3	1	12	40,75,120,225	179	Estudios	
LS4	10,30	12	400,750,1200	177	preliminares de	
LS5	1	19	4,8,12,23		trazas realizadas	
LS6	10,30		40,75,120		con láser.	
LS7	1		40,75,120,225	174		
LS8	10,30		400,750,1200	1/7		

LAC	0		25,80,100,140,240,260,350		Estudio del
LIN	30		25,30,55,88,120,180,300		Capítulo III.
LIN2	30		25,30,55,88,120,180,300	179	Igual que LIN. Distinta duración de los pulsos.
TCS1 TCS2 TCS3	0	19	100,140,240,350 / 0 μm 100,140,240,350 / 100 μm 100,140,240,350 / 300 μm	179	Trazas en modo continuo solapadas.

# E.3 Muestras con áreas.

Muestra	Frecuencia [kHz]	Intensidad [A]	Velocidad de barrido [mm/s]	Distancia entre trazas [µm]	Distancia lente- substrato [mm]	Tiempo de espera entre trazas [ms]	Comentarios
CT1	30			100 200			Matrices de
CT2	25	19	1,10,100,500,1200	300,400	179	0	áreas.
CT3	20			,			
CT4	30	12.15.19	100	100	174,179	0,10,100,	
011		12,10,19				1000	
CT5	1	19	1.10.100.500.1200	100,200,	170	0	
CT6	10		_,_ ,,_ ,,_ ,,_ ,,_ ,,_	300,400			
CT7	10	12,14,	50,100,200,	100			
CT8	1	16,18	300,400	100			
СТ9	20	19	1,10,100,	100,200,			
017			500,1200	300,400			
СТ10	20	12,14,	50,100,200,	100			
		16,18	300,400				
CT11	30	19	1,10,100,	100,200,			
			500,1200	300,400			
CT12	30	12,14,	50,100,200,	100			
	50	16,18	300,400	100			

CT12			30,40,50,60,70,80,	100,200,			
CIIS	10,20,30	18	100,120,140,160,180	300,400			
CT14			80-158	100	170,179		
CT15	30	10	100	200 300	170		Varias
CT16	50	19	100	200,300	170		pasadas.
CT17			80 100 120		179		Se calienta el
CT18	10,20,30	18	140,160	100	170		titanio a 400
							C.
аст	20	10	100	100	170		califolo de
201	30	19	100	100	1/9		marcado
PA1						1000	Paletas de
			100	300		1000	colores con
1 / 12	30	19			179		varias
PA3		- /	1200	200		0	pasadas.
PA4							Más pasadas.
PC1			20 - 120				
PC2			10 - 55			500	
PC3			120 - 161			500	
PC3	20	10	162 - 203	200			
PC5	50	19	20 - 120			0	Polotos do
PC6			10 - 285			Ū	
PC7			10 - 205				0010105.
PC8				100	179		
PC9	20	15.5	20 - 185				
PC10	20	18.5	20 105	200		500	
PC11	30	19				200	
PC12			25 - 300	200			Paletas en
PC13	0	19		100			modo
PC14			20 - 1200				continuo.
PC15			25 - 300	200		2000	
PAL1			50 - 350 / 50 - 350				Paletas de
PAL2			20 - 80 / 20 - 80				colores con
PAL3	30	19	30 - 90 / 100 - 400	200	179	500	solapamiento
PAL4			60 - 90 / 500 - 1100				bidimensional.
PAL5			25 - 55 / 500 - 1100				

G1							
G2			25	200			
G3			25	100			
G4				40			
V1				200			
V2			30	200			
V3			50	100			
V4				40			
A1				200			
A2			55				
A3				100			
A4				40			
L1				200			Áreas de
L2	30	19	88		179	500	colores en
L3				100			modo pulsado.
L4				40			
M1				200			
M2			120				
M3				100			
M4				40			
D1				200			
D2	-						
D3				100			
D4				40			
P1				200			
P2			300				
P3				100			
P4				40			
AC1			350				
AC2			260				Áreas de
AC3	0 19		240				colores en
AC4		19	140	100	179	2000	modo
AC5			100				continuo.
AC6			80				
AC7			25				
DP1	30	19	55 / 300	200	179	500	Doble pasada.

SOL1	30	19	20	200, 180, 160, 120	179	500	Evolución de los surcos.
EGYC	30	19	25	40	179	500	Estudio de la grietas diagonales.
VP1 VP2	30	19	55 , 1100 55, 300	200	179	500	Varias pasadas